

1. Определение прецизионных параметров монокристаллов на модифицированном рентгендифрактометре.
2. Методика проведения измерений шероховатости поверхности методом АСМ
3. Методика проведения измерений толщины нанослоев методом АСМ
4. Методика оценки достоверности изображений наномасштаба в методе АСМ
5. Методика оценки фазового состава по вязко-упругим свойствам фаз в методе АСМ
6. Методика исследования нано- и микрорельефа методом растровой электронной микроскопии
7. Методика исследования нано-и микроструктуры методом растровой электронной микроскопии
8. Методика проведения рентгеноспектрального элементного микроанализа в растровом электронном микроскопе
9. Методика исследования лабильных образцов в растровом электронном микроскопе
10. Методика локальных измерений концентрации кислорода методом вторично-электронной эмиссионной микроскопии
11. Методика локальных измерений фазового состава методом вторично-электронной эмиссионной микроскопии
12. Методика исследования фазового состава поверхности методом прецизионной электронографии
13. Методика исследования структуры поверхности методом прецизионной электронографии
14. Методика исследования поверхностных текстур методом прецизионной электронографии
15. Методика расшифровки структур монокристаллов.
16. Метод наименьших квадратов для уточнения параметров структур монокристаллов.
17. Методика для измерения спектров зеркального отражения от образцов
18. Методика исследования поверхности образцов с помощью приставки МНПВО
19. Методика для измерения спектров диффузного отражения от образцов
20. Методика регистрации спектров диффузного и зеркального отражения непрозрачных и сильно рассеивающих образцов в области 230-2600 нм.
21. Методика регистрации спектров поглощения и отражения малоразмерных (до 2 мм) образцов в области 230–2600 нм.
22. Методика регистрации поляризационных спектров поглощения прозрачных образцов в области 300–2500 нм.
23. Методика спектрально-люминесцентного анализа полимеров, содержащих несколько типов флуоресцирующих примесных центров и дефектов молекулярной цепи.
24. Методика измерений молекулярных масс полимеров методом светорассеяния
25. Методика измерений инкремента показателя преломления полимеров
26. Методика спектрального определения продуктов реакций в модифицированных промышленных полимерах